

Sistema de clasificación de Patentes

Debido a la gran diversidad de áreas del conocimiento y tecnologías aplicadas a estas, resulta indispensable clasificar las invenciones de acuerdo con su aplicabilidad en determinado campo; es así que actualmente existen diversos intentos para clasificación de patentes, que además resultan útiles en las estrategias de búsqueda y análisis de tendencias tecnológicas:

1.- Sistema Internacional de Clasificación de Patentes (CIP o IPC):

En su octava edición divide los ámbitos tecnológicos en unos 70.000 campos o grupos. Cada uno se corresponde con una determinada tecnología identificada mediante un "símbolo de clasificación" formado por una serie de cifras y letras. Los símbolos de la CIP suelen aparecer en los datos bibliográficos que figuran en los documentos de patente publicados.

2.- Sistema de Clasificación de Patentes de Estados Unidos:

Sistema utilizado por la Oficina de Patentes y Marcas de dicho país, que es diferente a CIP (no está basado en la CIP).

3.- Sistema de Clasificación de Patentes de la Oficina Europea (ECLA):

Este sistema está inspirado en la CIP, pero presenta otras subdivisiones en subgrupos específicos.

4.- Sistema File Index (FI/F):

Utilizado por la Oficina Japonesa de Patentes, basado en la CIP pero con subdivisiones adicionales y otros elementos de clasificación conocidos como "F terms") que se utilizan para indicar determinados aspectos o características técnicas de una invención, y que pueden ser utilizados para localizar tecnologías con dichos aspectos técnicos, independientemente de su campo de aplicación.

El CIP es el sistema de clasificación de patentes utilizado en México, y es también el más extendido a nivel mundial.